

Método para obtener puntas sensoras de microscopía de fuerza atómica funcionalizadas mediante silanización por vapor activado, y las puntas obtenidas por dicho método.

Información de contacto

Dirección: Principales:

- GUSTAVO VICTOR GUINEA TORTUERO

gustavovictor.guinea@upm.es

- JOSE PEREZ RIGUEIRO

jose.perez@upm.es

- LUIS COLCHERO .

- RAFAEL DAZA GARCIA

rafael.daza@upm.es

Tipo de oferta tecnológica

Patentes

¿Dónde?

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) Materiales Estructurales Avanzados y Nanomateriales

Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=1472&id_archivo=9945&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

Descripción de la patente

Un método para obtener una punta sensora de microscopía de fuerza atómica funcionalizada, caracterizado porque la funcionalización tiene lugar mediante un proceso de silanización por vapor activado que comprende: a) evaporar un compuesto organometálico que contiene al menos un átomo de silicio y al menos un grupo funcional seleccionado entre amino, hidroxilo, carboxilo y sulfidrido; b) activar el vapor del compuesto organometálico de la etapa a) mediante calentamiento; y c) hacer incidir el vapor activado de la etapa b) en una punta sensora para microscopía de fuerza atómica para depositar una lámina del compuesto organometálico sobre dicha punta sensora; donde las etapas b) y c) tienen lugar de forma consecutiva. Así como la punta sensora funcionalizada obtenida por dicho método.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P201830777

Número de publicación

ES2684851

Fecha de presentación

27/07/2018

Fecha de publicación

04/10/2018

Fecha de concesión

12/06/2019

Extensiones Internacionales**PCT****Referencia de la solicitud:** PCT/ES2019/070456**Título:** MÉTODO PARA OBTENER PUNTAS SENSORAS DE MICROSCOPIA DE FUERZA ATÓMICA FUNCIONALIZADAS MEDIANTE SILANIZACIÓN POR VAPOR ACTIVADO, Y LAS PUNTAS OBTENIDAS POR DICHO MÉTODO**EUROPA****Referencia de la solicitud:** 19841178.7**Título:** METHOD FOR OBTAINING FUNCTIONALISED SENSOR TIPS FOR ATOMIC FORCE MICROSCOPY BY MEANS OF ACTIVATED VAPOUR SILANISATION AND TIPS OBTAINED USING SAID METHOD**Situación:** Presentada**PAÍSES****País:** China**Número de solicitud:** 201980049873.2**Título:** Método para obtener puntas sensoras de microscopía de fuerza atómica funcionalizadas mediante silanización por vapor activado, y las puntas obtenidas por dicho método**Situación:** Presentada**País:** Estados Unidos**Número de solicitud:** 17/261,066**Título:** METHOD FOR OBTAINING FUNCTIONALISED SENSOR TIPS FOR ATOMIC FORCE MICROSCOPY BY MEANS OF ACTIVATED VAPOUR SILANISATION AND TIPS OBTAINED USING SAID METHOD**Situación:** Concedida